

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62586-2
Edition 1.0 2013-12

**POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER
SUPPLY SYSTEMS –**

**Part 2: Functional tests and uncertainty
requirements**

IEC 62586-2
Édition 1.0 2013-12

**MESURE DE LA QUALITE DE L'ALIMENTATION
DANS LES RESEAUX D'ALIMENTATION –**

**Partie 2: Essais fonctionnels et exigences
d'incertitude**

CORRIGENDUM 1

**Table 3 – Testing points for each
measured parameter**

Replace, in the row "Dips/Interruptions" and column "Testing point P1", for classes A and S, "Threshold dip-" by "Threshold dip+."

Replace, in the row "Dips/Interruptions" and column "Testing point P2", for class A and class S, "Threshold dip+" by "Threshold dip-."

6.4.1 General

In the existing table, in the row "A4.1.4" and column "Testing points according to Table 3", replace "P2 for Dips/Int." by "P3 for Dips/Int."

6.6.1 Measurement method

In the table, in the row "A6.1.6" and column "Target of the test", replace the existing text by:

"Check that a properly designed anti-aliasing filter is used on the device, providing (in combination with oversampling) an attenuation exceeding 50 dB for any frequency producing an alias below or up to the 50th harmonic."

7.12.3 Influence of temperature

In the table, in all the rows of the column

**Tableau 3 – Points d'essais pour
chaque paramètre mesuré**

Remplacer, dans la ligne "Creux, interruptions" et la colonne "Point d'essai P1", pour la classe A et classe S, "Creux-seuil" par "Creux+ seuil".

Remplacer, dans la ligne "Creux, interruptions" et la colonne "Point d'essai P2", pour la classe A et classe S, "Creux+ seuil" par "Creux- seuil".

6.4.1 Généralités

Dans le tableau existant, dans la ligne "A4.1.4" et la colonne "Points d'essai selon le Tableau 3", remplacer "P2 pour les Creux/Int." par "P3 pour les Creux/Int."

6.6.1 Méthode de mesure

Dans le tableau, dans la ligne "A6.1.6" et la colonne "Cible de l'essai", remplacer le texte existant par:

"Vérifiez qu'un filtre anti-repliement correctement conçu est utilisé sur l'appareil, en fournissant (en combinaison avec suréchantillonnage) une atténuation dépassant 50 dB de toutes les fréquences produisant un alias au-dessous ou jusqu'à la 50ème harmonique."

7.12.3 Influence de la température

Dans le tableau, dans toutes les lignes de